

プリント基板上有機物系異物の分析

適切なサンプリングで異物周辺情報の影響を軽減

測定法 : Raman
 製品分野 : 電子部品
 分析目的 : 組成評価・同定

概要

ラマン分析は微小異物の定性分析に有効な手法です。異物の下地情報を併せて検出するために分析が困難となる場合は、サンプリングを併用することにより分析が可能となります。

電極上異物は下地の影響のほとんど無くフラックスと同定されましたが、プリント基板上異物は異物由来の情報が取得できませんでした(図1)。下地の影響の無い無機結晶上にサンプリングを行うことで、異物の情報が得られ、異物はフラックスと同定されました(図2)。

データ

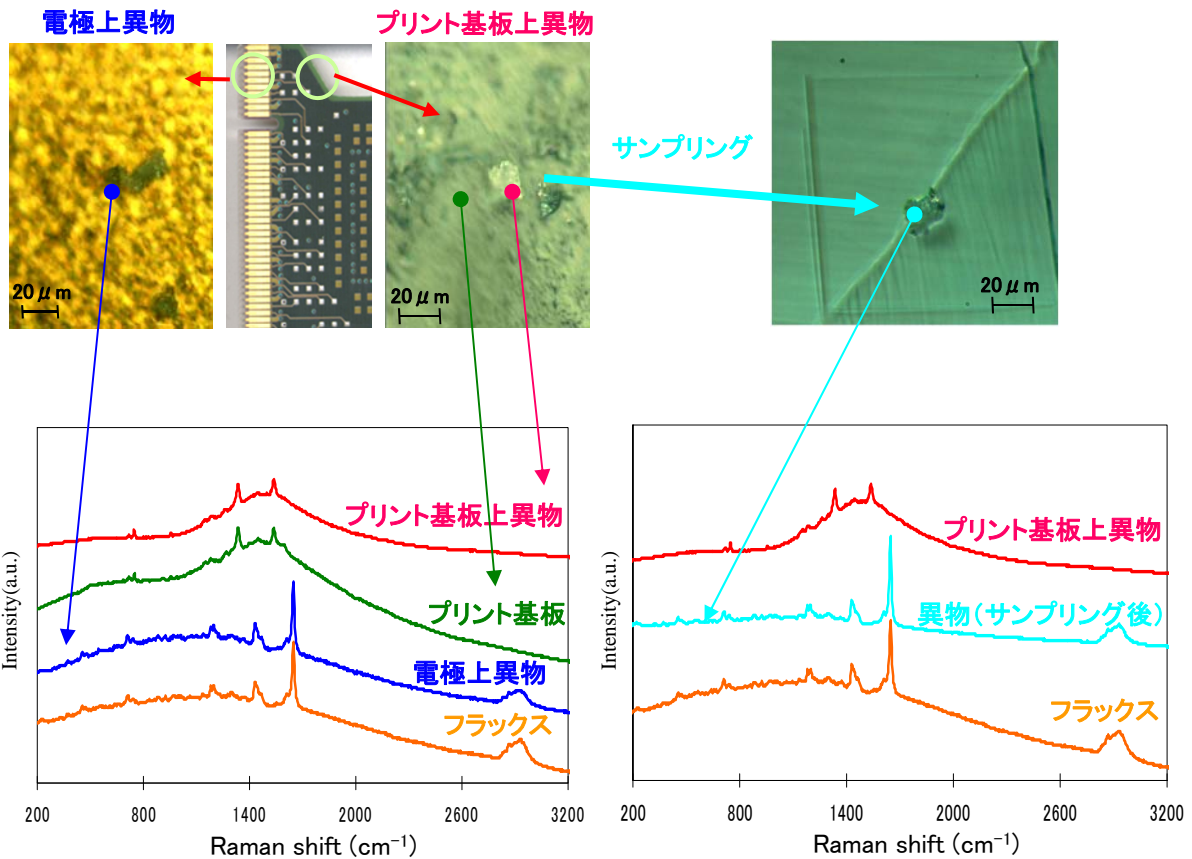


図1 ラマンスペクトル

図2 ラマンスペクトル

■適用例

プリント基板上、カラーフィルター上のような下地の影響の強い異物の定性分析

分析サービスで、あなたの研究開発を強力サポート！

一般財団法人
MIST 材料科学技術振興財団

TEL : 03-3749-2525 E-mail : info@mst.or.jp
 URL : <https://www.mst.or.jp/>